

XRR 解析レポート

プロジェクト

パス: 未保存

DBでの共有レベル: 共有

解析条件

波長(nm): 0.15403

点数: 1451

2θ(°):開始 = 0.200, 終了 = 6.000

ステップ = 0.004

オフセット = 0.000e+000

フィッティング手法: 遺伝的アルゴリズム

データ間隔: 1点ごとにフィッティング

残差タイプ: |Δ(LogI)|

母集団: 50

個体数: 50

ターゲットχ²: 1.00e-004

重み: 50%

クロスオーバー: 50%

装置関数: 擬Voigt関数

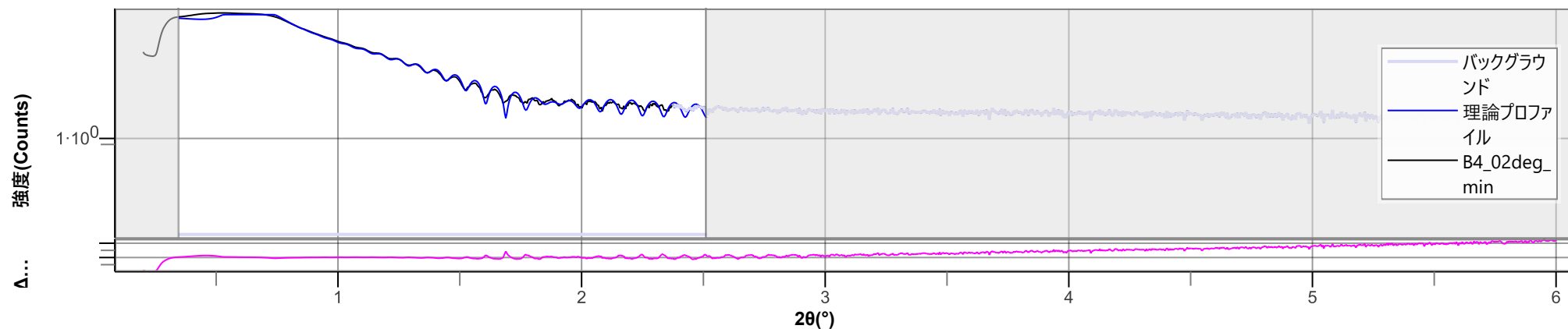
ローレンツ関数の比率: 0.00

ローレンツ幅: 1.00e-002

ガウス幅: 1.00e-002

結果

プロファイルプロット



使用	層番号 ▼	材料	膜厚(nm)<th>	密度(g/cm ³)<d>	粗さ(nm)<rg>
<input checked="" type="checkbox"/>	L3	Fe ₂ O ₃	0.000 Const ±5 最小一 精密化	4.95000 Const	6.939 Con...
<input checked="" type="checkbox"/>	L2	Fe ₂ O ₃	4.868 Const ±0.16 精密化	2.47500 Const	1.141 Con...
<input checked="" type="checkbox"/>	L1	Fe	92.397 Const ±0.6 精密化	7.50009 Const	1.500 Con...
<input checked="" type="checkbox"/>	基板	Si	∞	2.32924 Const	0.500 Con...